



テラヘルツ光源による高分子材料の 深部非破壊検査技術

日常生活に不可欠な高分子材料



内部の非破壊検査手法が必要

研究者名

渡邊 紳一

お問合せ先

watanabe@phys.keio.ac.jp

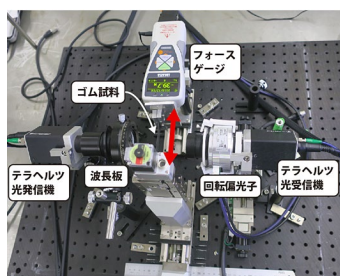
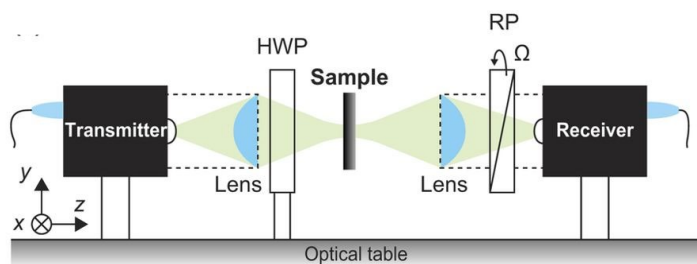
Keio University



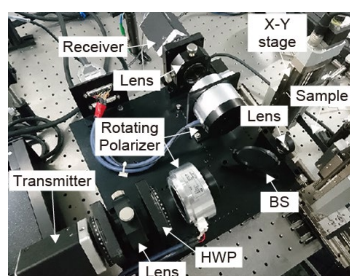
テラヘルツ光源による高分子材料の 深部非破壊検査技術

透過型検査装置

M. Okano and S. Watanabe, Sci. Rep. **6**, 39079 (2016).



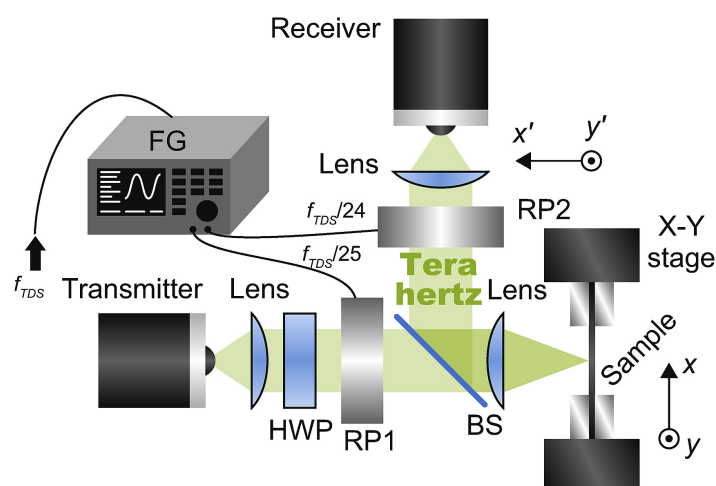
透過型検査装置 (JST プレスリリースより)



反射型検査装置

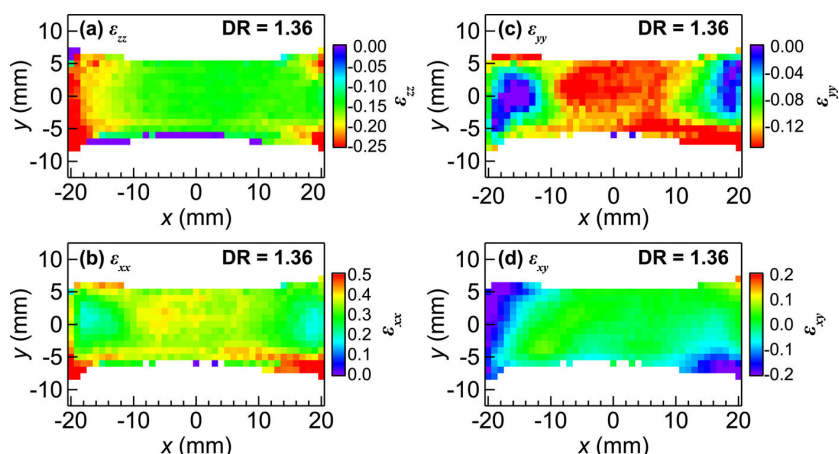
反射型検査装置

M. Okano, and S. Watanabe, Polym. Test. **72**, 196-201 (2018).



延伸ゴムの 三軸ひずみマッピング

A. Moriwaki, *et al.*, APL Photonics **2**, 106101 (2017).



研究者名

渡邊 紳一

お問合せ先

watanabe@phys.keio.ac.jp

プラスチック材料の ひずみ検査

H. Iwasaki *et al.*, J. Phys. Chem. B **121**, 6951-6957 (2017).

